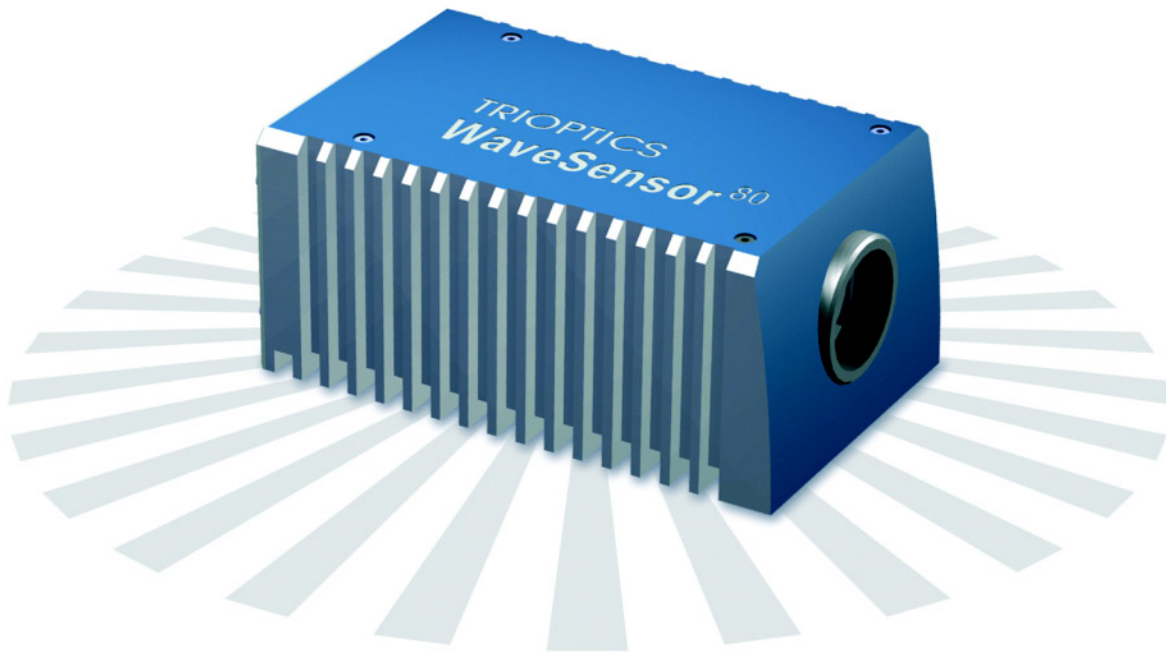


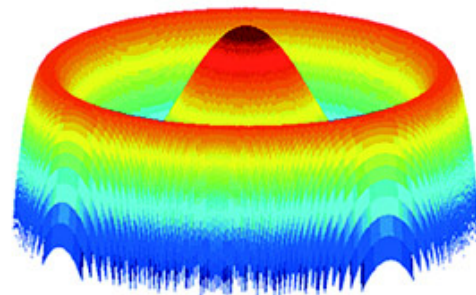
WaveSensor® 波前传感器

WaveSensor® 系列产品是应用哈特曼—夏克传感器的测量原理研制而成的，并配备专门的操作与分析软件，可用于激光光束质量及其动态变化的诊断、光学系统像质的检验、介质扰动对光束质量影响的测量、大型球面镜镜面面形精度的检测等。利用 WaveSensor® 可获得丰富的光束质量及空间、时间信息，是深入研究激光光束和光学系统质量及其动态变化过程、分析影响因素的有力手段，因此 WaveSensor® 已成为检测各类大型反射镜面形的一种专用设备。



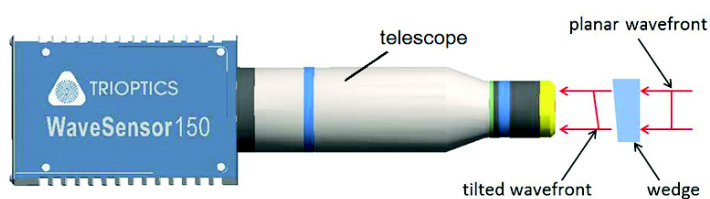
应用范围

- 常规光学元件面形检测（平面、球面、透镜等）
- 大口径光学元件检测
- 光学系统像差检测
- 激光器输出波面检测
- 光束质量诊断
- 光束动态变化测量
- 自适应系统的波前探测

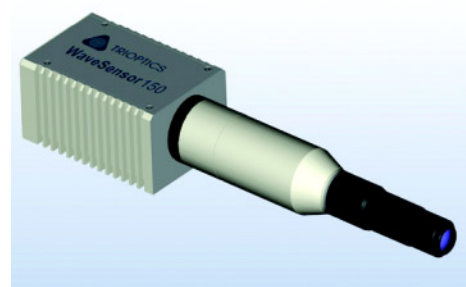


产品型号及技术指标

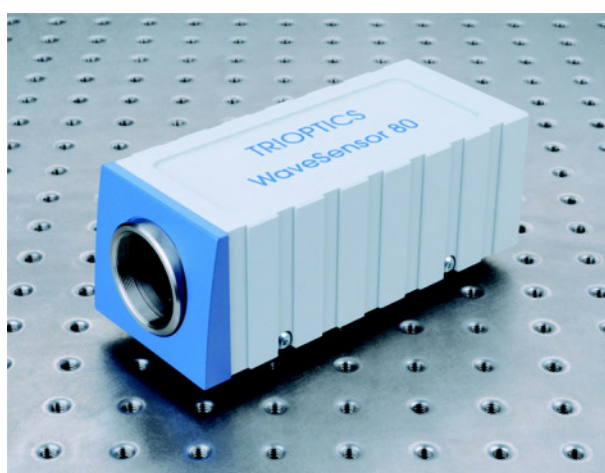
产品型号	WaveSensor [®] 150	WaveSensor [®] 100	WaveSensor [®] 80	WaveSensor [®] 60
孔径尺寸	15mm × 15mm	15mm × 15mm	6.6mm×8.8 mm	4.8mm×6.4 mm
阵列透镜数	138 × 138	100 × 100	60 × 80	45 × 60
动态范围	2000 λ	> 1500 λ	> 1000 λ	> 800 λ
倾斜测量灵敏度	< 1 μ rad	< 1 μ rad	< 1 μ rad	< 1 μ rad
绝对精度(RMS)	< λ /20	< λ /20	< λ /20	< λ /20
重复性(RMS)	< λ /200	< λ /200	< λ /200	< λ /200
波长	405-1100nm (可扩展至 350nm)			
接口类型	IEEE1394B			
产品尺寸	74 mm × 100 mm × 144 mm			
产品重量	1000 g	1000 g	800 g	800 g



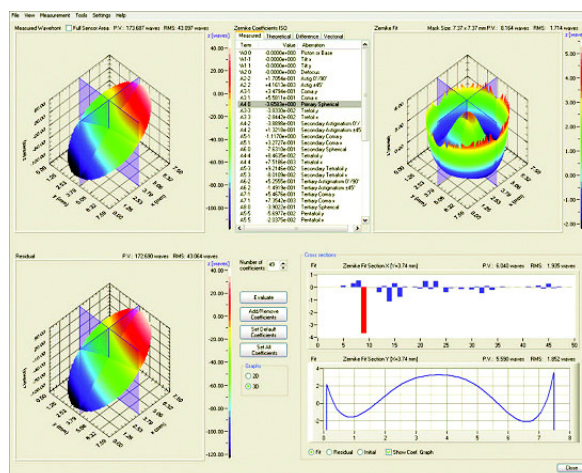
波前传感器应用示例



WaveSensor[®] 150



WaveSensor[®] 80



泽尼克多项式分析波前软件界面